This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-157419

(43) Date of publication of application: 30.06.1988

(51)Int.CI.

H01L 21/30 G03F 7/20

(21)Application number: 61-303987

(71)Applicant: TOSHIBA CORP

(22)Date of filing:

22.12.1986

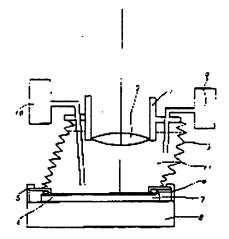
(72)Inventor: NAKASUJI MAMORU

(54) FINE PATTERN TRANSFER APPARATUS

(57)Abstract:

PURPOSE: To improve resolution by making use of a refraction index of liquid, on the occasion of transferring fine pattern using the light, by filling an optical path between the final lens and specimen with a liquid and reducing defocusing of light by refraction.

CONSTITUTION: A bellows 3 is attached to the outside of optical barrel 1, shielding the light progressing space from outside. The interior 11 of bellows 3 is filled with a liquid having a high refraction index and the liquid is sealed by an O ring 4 not to release to the outside. Here, a lens 2 is designed so as to match the refraction index to the specimen 6 with the refraction index of liquid. When refraction index of liquid is considered as n, wavelength becomes 1/n and n times of resolution can be obtained. Here, the specimen is fixed flat by a chuck plate 7 and the O ring is clamped by a tightening jig 5. The specimen can also be moved in the x and y directions by a stage 8. Upon completion of transfer, a purge apparatus 10 operates, exhausting the liquid, and thereby a wafer may be exchanged.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

⑩日本国特許庁(JP)

10 特許出額公開

砂公開特許公報(A)

昭63-157419

@Int_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

❷公開 昭和63年(1988)6月30日

H 01 L '21/30 G 03 F 7/20

3 1 1

L-7376-5F 7124-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全2頁)

微細パターン転写装置 G)発明の名称

四 四61-303987 创特

顧 昭61(1986)12月22日 の出

筯 砂発 明 者

神奈川県川崎市幸区小向東芝町 1 株式会社東芝総合研究 箑

所内

株式会社東芝 ①出 四

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

外1名 弁理士 則近 の代 理

発明の名称

世組パターン転写芸量

特許請求の範囲

(1) 光あるいは 無外線で試料上に 敬細 パターンを 転写する袋屋において、最終レンズと試料間の光 の通路を放体で潰したことを特徴とする鉄細パタ ニン転写袋産。

(2)レンズと試料間の空間に液体を高速で完満さ せあるいは高速でパージさせる英俚を備えたこと を特徴とする特許請求の範囲第1項記載の敬細パ ターン転写袋筐。

(3) ベローズ及びOリングで光の通路を含む空間 を密閉できることを特徴とする特許請求の範囲第 1.項記載の敬細パターン転写装置。

3. 発明の詳細な説明

(発明の目的)

(産業上の利用分野)

この発明はサブミクロンパターンをウェーハ等 の飲料に形成する敬細パターン転写装盤に関する。 (従来の技術)

従来、尤を用いて徴細パターンを転写する場合 団折による限界があるため、隣口を大きくすると か、短波長の光を用いる等の工夫が行われている が十分とは言えないのが現状である。

(発明が解決しようとする問題点)

本発明はこのような事情に強みなされたもので、 回折による光のポケを低波した微細パターン転写 袋壁を提供することを目的とする。

(発明の構成)

(問題点を解決するための手段)

従来、顕敬鏡の対物レンズと試料間にオイル等 の液体を消たせば高解像になることは知られてい る。この原理をステッパーあるいはアライナに応 用する。この時間題になるのは、顕敬義と異なり **試料は大きく視野も10m角程度と大きく且つ試** 科とレンズ間の距離が大きいので液体をレンズと 試料間に如何にして保持するかが問題となる。 さ らにステッパーの場合、試料をステップアンドリ ピートさせる必奴がありこの対策も必要である。

特閒昭63-157419(2)

本発明では高周折率の液体を用い回折を小さく し、0 リングとペローズで光の通る空間を密閉し 液体を充満可能にし、ペローズでレンズと試料が 動く余裕を作った。

(作用)

本発明に於いて、例えば屈折率が 1.5 の液体を用いれば放長が 1/1.5になり、回折が 1/1.5になるので、例えば 0.5 mmの解像度を持つ光学系を用いれば 0.3 3 mmに解像度を上げることができる。(実施例)

 x , y 方向に移動できる。 転写が完了すると、パージ装置 1 0 が作動して放体を造出し、ウェーハが交換される。その後被体供給装置 9 が作動して放体を充満させた装転写が行われる。

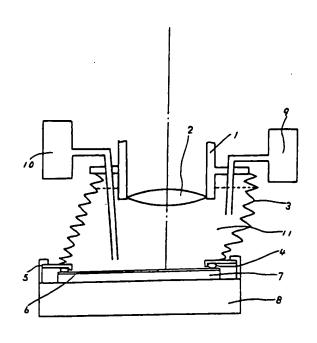
[発明の効果]

太恭明によれば次の効果を奏する。

- (1) 液体の屈折率を□とすると□倍の解像力が視
- (2) ペローズでシールされているためェッ方向に 移動が可能である。
- (3) 高速で放体をパージしたり、供給したりする 装量を持つのでスループットが落ちない。
- 4. 図面の簡単な説明

第1回は本発明による転写装成の一実施例の主 摂部を示す断面図である。

1 ··· 光学説前、 2 ··· 最終レンズ。 3 ··· ベローズ、 4 ··· 〇リング、 5 ··· 〇リング押え金具、 6 ··· 試料 ウェーハ、 7 ··· チャック板、 8 ··· × アステージ、 9 ··· 液体供給装置、 1 0 ··· 液体パージ装置。



1 E